

2022年9月吉日

お客様各位

株式会社日立ハイテクフィールドディング
ナノテクノロジーサービス本部 電子顕微鏡部

日立ハイテク及び日立ハイテクサイエンス製解析製品 サービス料金改定のお知らせ

拝啓、時下益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。また、平素より日立ハイテク製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご高承のとおり、昨今の各種経費及び人材確保に伴うコストは上昇の一途をたどっておりますが、弊社としても継続的な経費削減、合理化により安定したサービス品質を提供しつつ、サービス料金の維持に努めて参りました。しかしながら、弊社内での自助努力も限界を迎え、誠に心苦しいところではありますが、この度技術料金体系について見直しを実施させて頂く運びとなりました。

つきましては、10月1日より下記のとおりサービス料金について改定を実施させていただきますので、何卒ご理解とご協力と賜ります様お願い申し上げます。

尚、弊社と致しましても今後ともお客様に寄り添った安定したサービス品質の提供によりお客様装置の安定稼働、価値向上に努力して参りますので、今後とも引き続きご愛顧を賜ります様お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

1. 価格改定時期

2022年10月1日(土)新規見積発行分から

2. 対象製品

日立ハイテク製電子顕微鏡、集束イオンビーム、走査型プローブ顕微鏡、
ナノ3D光干渉計測システムおよび周辺機器

3. 価格改定の内容

従来の料金体系より、以下の通り変更させていただきます。

保守契約・予防保全・改良作業(事前見積)のサービス料金体制について

- ・技術料(1工数)について、従来の全製品一律の料金体制より製品カテゴリ別料金体制に変更させていただきます。また、装置納入後10年(一部装置は7年)を経過した装置について、別途長期稼働装置として割増料金をご請求させていただきます。
- ・弊社請負サービス拠点よりお客様納入先迄の移動に要する費用を、別途派遣費としてご請求させていただきます。

保守契約・予防保全・改良作業サービス料金体系

製品カテゴリ	変更前	変更後
電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM) 電界放出形透過電子顕微鏡(FE-TEM) 透過走査電子顕微鏡(STEM)、集束イオンビーム加工観察装置(FIB) FIB-SEM 複合装置(FIB-SEM)、ナノ・プローバ(NP)	一律	技術料 A
走査電子顕微鏡(SEM)、透過電子顕微鏡(TEM)、 走査プローブ顕微鏡(AFM(中型))、白色干渉顕微鏡(CSI(中型))		技術料 B
卓上顕微鏡(TM)、イオンミリング装置(IM) 走査プローブ顕微鏡(AFM(小型))、白色干渉顕微鏡(CSI(小型))		技術料 C

製品不具合対応作業(事後見積)のサービス料金体制について

- ・技術料(1時間単位)について、従来の全製品一律の料金体制より製品カテゴリ別料金体制に変更させていただきます。また、装置納入後10年(一部装置は7年)を経過した装置について、別途長期稼働装置として割増料金をご請求させていただきます。

製品不具合対応作業サービス料金体系

製品カテゴリ	変更前	変更後
電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)、走査電子顕微鏡(SEM) 電界放出形透過電子顕微鏡(FE-TEM)、透過電子顕微鏡(TEM) 透過走査電子顕微鏡(STEM)、集束イオンビーム加工観察装置(FIB) FIB-SEM 複合装置(FIB-SEM)、ナノ・プローバ(NP) 走査プローブ顕微鏡(AFM(中型))、白色干渉顕微鏡(CSI(中型))	一律	製品不具合 技術料 A
卓上顕微鏡(TM)、イオンミリング装置(IM) 走査プローブ顕微鏡(AFM(小型))、白色干渉顕微鏡(CSI(小型))		製品不具合 技術料 B

本件に関するお問い合わせ
株式会社日立ハイテクフィールドディング
ナノテクノロジーサービス本部 電子顕微鏡部
サービス料金改定お問合せ窓口
電話：0120-203-813
以上